

Модели на основе распределения Вейбулла-Гнеденко
для описания деградации функциональных
параметров изделий электронной техники

Сергей Максимович Боровиков,

*Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники*

Е. Н. Шнейдеров, И. А. , И. А. Бурак

Аннотация: Математическую модель деградации функционального параметра в виде условной плотности предлагается получать на основе трехпараметрического распределения Вейбулла-Гнеденко.

Ключевые слова: математические модели, деградации функционального параметра, электронная техника, параметрическая надежность систем, биполярные транзисторы, Вейбулла-Гнеденко, распределение, изделия электронной техники, распределение Вейбулла-Гнеденко